

Join the 13th edition of Metromeet

Register online
www.metromeet.org

Discounts

The sooner you register the greater benefit you enjoy. We have a special discount for the ones who decide early:

- 25% discount on any registration made before February 15th

If you belong to a "special" group as listed below, you can have a discount as well, and of course those discounts count all the time.

- 50% discount for students
- 20% discount for sponsors
- 15% discount for supporting exhibitors
- 10% discount for organisations

These discounts are not cumulative. If you apply more than one discount, only the biggest one will be taken into account.

Fees

- Metromeet Complete (3 days)
800€ + VAT
- Metromeet Conference (2 days)
600€ + VAT
- Metromeet Automotive & Wine (1 day)
250€ + VAT

Observations

(*) In agreement with Article 5 and concordant with the current Organic Law 15/1999, 13 of December, Protection of Personal Data (BOE, Character data num. 298, of 14-12-1999), the Innovalia Association, S.A., informs you that an automated file exists with data of a personal character, the purpose of which is to inform you about the activities of a divulgant, educational or scientific nature carried out by the company that may interest you.
The organisation in charge of this file is Asociación de Empresas Tecnológicas Innovalia, with address in C/Rodríguez Arias, nº6 6º 48008 Bilbao (Vizcaya), VAT G-95210910, telephone +34 94 480 51 83 and fax +34 94 480 51 84.
In agreement with the law before mentioned, you can any time exercise the rights of access, rectification, cancellation and opposition notifying it writing to the direction before expressed or the electronic mail".

Ven a la 13^o edición de Metromeet

Inscríbete en
nuestra web
www.metromeet.org

Descuentos

Cuanto antes gestiones tu inscripción, disfrutarás de más beneficios. La organización de Metromeet tiene un descuento especial para los que antes se decidan:

- 25% de descuento para inscripciones realizadas antes del 15 de febrero

Si perteneces a algún grupo de los mencionados a continuación, puedes obtener un descuento especial.

- 50% de descuento para estudiantes
- 20% de descuento para sponsors
- 15% de descuento para expositores
- 10% de descuento para empresas colaboradoras

Los descuentos no son acumulables. En caso de que corresponda la aplicación de más de un descuento, se aplicará el mayor.

Precio

- Metromeet Complete (3 días)
800€ + IVA
- Metromeet Conference (2 días)
600€ + IVA
- Metromeet Automotive & Wine (1 día)
250€ + IVA

Observaciones

(*) "De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 y concordantes de la vigente ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14-12-1999), la Asociación de Empresas Tecnológicas Innovalia le informa de que existe un fichero automatizado de carácter personal que tiene como finalidad informar sobre las actividades de carácter divulgativo, docente o científico de esta empresa que pudieran interesarle.
El responsable de dicho fichero es la dirección de la Asociación de Empresas Tecnológicas Innovalia, con domicilio en C/Rodríguez Arias, nº6 6º 48008 Bilbao (Vizcaya), CIF G-95210910, teléfono +34 94 480 51 83 y fax +34 94 480 51 84.
De acuerdo con la ley antes citada, puede usted ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, notificándolo por escrito a la dirección antes expresada o al correo electrónico".

Register online
Inscríbete en nuestra web
www.metromeet.org

Contact Information
Información de contacto
Tel.: (+34) 94 480 51 83
info@metromeet.org

Organiser

innovalia
ASSOCIATION

Sponsors

innovalia
METROLOGY

RENISHAW
apply innovation™

FARO

ZEISS

Exhibitors

DATAPIXEL
QUALITY CONTROL ENGINEERING

TRIMEK
METROLOGICAL ENGINEERING

UNIMETRIK
METROLOGY AND CALIBRATION



Metromeet

Preliminary
Programme

13th International Conference on Industrial Dimensional Metrology



22 + 23 + 24
MARCH
► 2017 ◀
Bilbao / SPAIN

www.metromeet.org

March **22** Marzo

March **23** Marzo

March **24** Marzo

08:30 - 09:00 **Registration + Coffee**

09:00 - 11:15 **TUTORIAL 1**

QIF and the Future of Digital Metrology
Daniel Campbell / Metrosage (USA)

11:15 - 12:00 **WATIFY Coffee Break + MetroLab**

12:00 - 12:30 **OPENING**

12:30 - 13:30 **KEYNOTE 1**

The future of Big Data for Industry 4.0
Aleksei Resetko / PwC (Germany)

13:30 - 15:00 **Lunch · Jauregia Restaurant**

15:00 - 16:00 **TRACK 1 · Industrial Metrology**

15:00 - 15:30 Inspection for Additive Manufacturing
Philip Hewit / Autodesk (United Kingdom)

15:30 - 16:00 Hybrid measurements
Ainhoa Etxabbarri / Innovalia Metrology (Spain)

16:00 - 17:00 **TRACK 2 · Industrial Metrology Solutions**

16:00 - 16:30 Implementation of a robustness test for mould validation
Lorenzo Carli / Novo Nordisk (Italy)

16:30 - 17:00 Software solutions for 3D Printings
Fernando Perales / Trimek (Spain)

17:00 - 18:00 **KEYNOTE 2**

Towards zero-defect Manufacturing: a machine learning approach
Serafeim Moustakidis / Centre for Research & Technology Hellas (CERTH) (Greece)



20:30 - 23:00 **Conference Banquet · Sociedad Bilbaína**

09:00 - 09:30 **Registration**

09:30 - 11:45 **TUTORIAL 2**

Metrology 4.0 for Industry 4.0
Toni Ventura-Traveset / Datapixel (Spain)

11:45 - 12:30 **Coffee Break + MetroLab**

12:30 - 13:30 **KEYNOTE 3**

Metrological requirements in astrophysical instrumentation
Juan Calvo / Institute of Astrophysics of the Canary Islands – IAC (Spain)

13:30 - 15:00 **Lunch · Jauregia Restaurant**



15:00 - 16:00 **TRACK 3 · Laser Manufacturing and Measuring**

15:00 - 15:30 Laser Measuring machine for rubber seals
Corrado Luca Bottazzi and Giulio Barbato / TENUTE SRL and Politecnico di Torino (Italy)

15:30 - 16:00 New multi-axis calibration technology
Laurence Rosser / Renishaw (United Kingdom)

16:00 - 18:00 **TRACK 4 · Micro-Metrology Industrial Solutions**

16:00 - 16:30 Results of EMRP-project "Multi-sensor metrology for microparts in innovative industrial products – Microparts"
Ulrich Neuschaefer-Rube / PTB (Germany)

16:30 - 17:00 High-speed microscopy for industrial inspection
Niels Koenig / Fraunhofer IPT (Germany)

17:00 - 17:30 Development and validation of a ultraprecision Small Angle Generator
Aitor Olarra / Tekniker (Spain)

18:00 - 19:00 **ROUND TABLE + CLOSING**

· **Metromest and Wine** ·



Metromest is a unique event that brings together the leaders in the field with the goal of sharing the latest developments on digital, optical, metrology, calibration and nano technologies.

This edition of Metromest will have an **extra day focused on the Automotive and the Aeronautic sector**. On **March 24th**, Metromest will give you the chance to discover the details and specific needs of these sectors while enjoying the experience of being in a true Spanish Winery.

Metromest es un evento único que atrae a los líderes mundiales en este sector con el fin de presentar los últimos desarrollos digitales y ópticos, software metrológico, nanotecnología y estándares de calibración.

En esta edición de Metromest, hemos añadido una nueva **jornada especial dedicada al mundo de la aeronáutica y la automoción**. Durante la mañana del **viernes 24 de marzo** organizaremos una serie de sesiones destinadas a conocer las necesidades de estos sectores y presentar soluciones metrológicas específicas.

08:30 **Departure from Bilbao | Euskalduna Palace**

09:45 **Arrival to the Winery**

10:00 - 11:30 **Metrology in Aeronautics and Automotive**

3 Tracks to discuss and discover the true metrological needs in the aeronautics and automotive sectors

11:30 - 12:00 **Coffee Break**

12:00 - 13:30 **Success Stories**

Real cases: Definition of the main obstacles in the quality management of different sectors and their solutions

13:30 - 16:00 **Visit to the Winery + Lunch**

16:00 **Departure to Bilbao**

*Simultaneous translation of all presentations will be made available to all attendees. / Todas las presentaciones tendrán traducción simultánea.
*The organization reserves the right to reschedule, add or cancel presentations. / La organización se reserva el derecho a modificar horarios, añadir o cancelar presentaciones.